УДК 621.535

## ВЛИЯНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ СРЕДЫ НА ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ОТРАЖЕНИИ СВЕТА

## А.А.Голубков, В.А.Макаров

(кафедра общей физики и волновых процессов)

Показано, что вопреки мнению ряда авторов наблюдавшиеся в последнее время поляризационные эффекты при взаимодействии света малой интенсивности с кристаллами класса  $\overline{4}3m$  (GaAs, InSb) не являются свидетельством нарушения принципа симметрии кинетических коэффициентов в этих кристаллах, так как обусловлены главным образом приповерхностной неоднородностью их оптических свойств. Указаны поляризационные эффекты, обнаружение которых действительно подтвердило бы нарушение принципа симметрии кинетических коэффициентов в этих кристаллах.

В последнее время было опубликовано несколько интересных экспериментальных работ [1–3], в которых сообщается о наблюдении поляризационных эффектов при нормальном отражении света малой интенсивности от поверхности [001] кристаллов класса 43m (GaAs, InSb), а также при прохождении света вдоль оптической оси таких кристаллов. При этом утверждается, что наблюдаемые эффекты обусловлены отличием от нуля симметричной (по перестановке первых двух индексов) части тензора  $\gamma_{ijk}$ , описывающего нелокальность опти-

ческого отклика среды в подходе Ландау-Лифшица:

$$D_i = \varepsilon_{ij} E_j + 4\pi \gamma_{ijk} \nabla_k E_j, \tag{1}$$

и делается вывод, что в указанных кристаллах имеет место нарушение принципа симметрии кинетических коэффициентов, свидетельствующее о наличии в них слабых магнитных структур (антисимметричная по перестановке первых двух индексов часть  $\gamma_{ijk}$  в кристаллах класса  $\overline{43m}$  всегда равна нулю по причине симметрии). Такое объяснение наблюдавшихся в работах [1–3]

эффектов уже подвергалось критике [4]. Однако эта критика носила исключительно качественный характер.

Целью настоящего сообщения является количественный анализ отмеченных эффектов, показывающий, что из экспериментальных результатов работ [1–3] на самом деле следуют выводы, противоположные тем, которые сделаны их авторами. В данной работе также выявлено принципиально новое направление экспериментального поиска проявлений возможного неравенства нулю симметричной части тензора пространственной дисперсии  $\gamma_{ijk}$ .

Предположим, что в образцах, исследованных в работах [1-3], в силу каких-то причин симметричная (по перестановке первых двух индексов) часть тензора  $\gamma_{ijk}$  действительно не равна нулю, и рассмотрим нормальное падение света на поверхность кристалла класса  $\overline{43}m$ , перпендикулярную его кристаллофизической оси [001] (ось  $X_3$ ). При отсутствии поверхностных дефектов эта поверхность имеет три элемента симметрии: поворотную ось симметрии второго порядка (2<sub>X<sub>s</sub></sub>) и две взаимно перпендикулярные плоскости симметрии  $(m_{X_1X_2}, m_{-X_1X_2})$  [5]. Иными словами, класс симметрии поверхности — mm2, но ее кристаллофизические оси x и у повернуты на 45° относительно кристаллофизических осей X<sub>1</sub> и X<sub>2</sub> самого кристалла. В дальнейшем мы будем в основном проводить вычисления в системе координат x, y, z ( $z = X_3$ ). В этой системе материальные тензоры, характеризующие линейный оптический отклик рассматриваемых сред, имеют вид

$$\varepsilon_{ij} = \varepsilon_1 \delta_{ij}; \quad \gamma_{113} = \gamma_{131} = \gamma_{311} = \gamma_0, 
\gamma_{223} = \gamma_{232} = \gamma_{322} = -\gamma_0,$$
(2)

остальные  $\gamma_{ijk} = 0$ . Здесь  $i, j, k = 1, 2, 3; \delta_{ij}$  — символ Кронекера, а индексы 1, 2 и 3 соответствуют осям x, yи z.

Простая подстановка в волновое уравнение

$$k^{2}\mathbf{E} - \mathbf{k}(\mathbf{k}\mathbf{E}) = \frac{\omega^{2}}{c^{2}}\mathbf{D}$$
(3)

дает возможность легко убедиться, что в первом приближении по параметру пространственной дисперсии  $\mu = \omega |\gamma_0|/c$  волны  $\mathbf{E}^{(+)}(z,t)$  и  $\mathbf{E}^{(-)}(z,t)$ , распространяющиеся соответственно в положительном и отрицательном направлениях оси *z*, могут быть представлены в виде

$$\mathbf{E}^{(+)}(z,t) = \left(E_{1x}e^{-\rho_0 z}\mathbf{e}_x + E_{1y}e^{\rho_0 z}\mathbf{e}_y\right)\exp\left(ik_1 z - i\omega t\right),$$
(4.)
$$\mathbf{E}^{(-)}(z,t) = \left(E_{2x}e^{-\rho_0 z}\mathbf{e}_x + E_{2y}e^{\rho_0 z}\mathbf{e}_y\right)\exp\left(-ik_1 z - i\omega t\right),$$
(4.)

где  $\rho_0 = 2\pi\gamma_0\omega^2/c^2$ ,  $k_1^2 = \omega^2\varepsilon_1/c^2$ ,  $\mathbf{e}_x$  и  $\mathbf{e}_y$  — единичные орты осей x и y соответственно,  $\omega$  — частота падающего света.

Для нахождения характеристик отраженного и прошедшего света воспользуемся уточненными граничными условиями, позволяющими в модели резкой границы учитывать влияние реально существующей приповерхностной неоднородности среды [6, 7]. В случае нормального падения света их можно представить в виде

$$E_{x,y}^{(2)} = E_{x,y}^{(1)}, \qquad \left[\mathbf{n}, \mathbf{B}^{(2)} - \mathbf{B}^{(1)}\right] = \frac{4\pi\hat{\eta}}{c} \frac{\partial \mathbf{S}}{\partial t}, \qquad (5)$$

где **n** — вектор единичной нормали, направленный из среды 1 в среду 2, **B** — индукция магнитного поля волны, **B**<sup>(m)</sup>, **E**<sup>(m)</sup> — значения полей в среде m(m = 1, 2) вблизи границы, **S** = **E** + (**D** – **E**, **n**)**n**, а  $\hat{\eta}$ характеризует диэлектрические свойства отражающей поверхности. С учетом симметрии последней тензор  $\hat{\eta}$ имеет диагональный вид [5] независимо от его внутренней симметрии.

Эксперименты [1–3] проводились при почти нормальном падении света (отклонения составляли ~ 1°). При расчетах это позволяет, с одной стороны, считать падение света строго нормальным, а с другой — пренебречь эффектами, связанными с многократными отражениями от противоположных граней кристалла. В этом приближении, пользуясь (4) и (5), можно показать, что  $\mathbf{E}^{(r)}$ ,  $\mathbf{E}$  и  $\mathbf{E}_{2}^{(r)}$  — соответственно амплитуды отраженной, однократно прошедшей среду и дважды прошедшей среду (туда и обратно после отражения от расположенного за кристаллом зеркала) волн следующим образом связаны с амплитудой падающей волны  $\mathbf{E}^{(i)}$ :

$$E_{x,y}^{(r)} = \left(-R + r_{x,y}^{(1)}T_0\right) E_{x,y}^{(i)},$$

$$E_{x,y} = T_0 T_1 \left(1 + r_{x,y}^{(1)}\right) \left(1 + r_{x,y}^{(2)}\right) \exp\left(\mp\rho_0 L\right) E_{x,y}^{(i)}, \quad (6)$$

$$E_{2x,2y}^{(r)} = -T_0^2 T_1^2 \left(1 + r_{x,y}^{(1)}\right)^2 \left(1 + r_{x,y}^{(2)}\right)^2 E_{x,y}^{(i)},$$

где L — длина среды,  $R = (k_1 - k_0)/(k_1 + k_0)$ ,  $T_0 = 2k_0/(k_1 + k_0)$ ,  $T_1 = 2k_1/(k_1 + k_0)$ ,  $k_0 = \omega/c$ ,  $r_{x,y}^{(m)} = i\Delta_{x,y}^{(m)}/(k_1 + k_0)$ ,  $\Delta_{x,y}^{(m)} = \Delta_{1,2}^{(m)} \pm (-1)^m \rho_0$ ,  $\Delta_{1,2}^{(m)} = 4\pi\omega^2 \eta_{1,2}^{(m)}/c^2$ ,  $\eta_1^{(m)} = \eta_{11}^{(m)}$ ,  $\eta_2^{(m)} = \eta_{22}^{(m)}$ , m = 1, 2,  $\hat{\eta}^{(1)}$  и  $\hat{\eta}^{(2)}$  характеризуют диэлектрические свойства передней и задней поверхностей соответственно. Соотношения (6) получены в первом приближении по параметрам  $\mu$  и  $\mu_1$ , где  $\mu_1 \propto |\hat{\eta}|/k_1$  характеризует влияние приповерхностной неоднородности кристалла на отражение и преломление света. В этом же приближении и в предположении  $\rho_0 L \ll 1$  (последнее следует из малости эффектов, наблюдавшихся в работе [2]) из (6) нструдно получить, что в случас падения на кристалл линейно поляризованного света поворот его плоскости поляризации в рассматриваемых трех случаях определяется следующими соотношениями:

при отражении света

$$\Delta \beta_r = \operatorname{Im} \left\{ \frac{k_0 \left( \Delta_2^{(1)} - \Delta_1^{(1)} + 2\rho_0 \right)}{k_1^2 - k_0^2} \right\} \cos\left(2\beta_0\right), \quad (7.1)$$

при однократном прохождении света через кристалл

$$\Delta\beta_t = (\operatorname{Re}\{\rho_0 L\} + \operatorname{Im}\{\Delta_s\})\cos(2\beta_0), \qquad (7.2)$$

при прохождении света через кристалл и обратно

$$\Delta\beta_{2r} = 2 \operatorname{Im}\{\Delta_s\} \cos\left(2\beta_0\right). \tag{7.3}$$

В (7)  $\Delta_s = \left(\Delta_1^{(1)} - \Delta_2^{(1)} + \Delta_1^{(2)} - \Delta_2^{(2)}\right) / [2(k_1 + k_0)], \beta_0$  — угол поворота плоскости поляризации падающего света относительно кристаллофизической оси  $X_1$  ([100]) кристалла (а не оси x, повернутой относительно оси  $X_1$  на 45°). Для сравнения воспроизведем (в наших обозначениях) формулы для  $\Delta\beta_r$  и  $\Delta\beta_t$ , приведенные в работе [2] (формула для  $\Delta\beta_{2r}$  в [2] отсутствует):

$$\tilde{\Delta}\beta_r = \operatorname{Im}\left\{\frac{4k_0\rho_0}{k_1^2 - k_0^2}\right\}\cos\left(2\beta_0\right),\tag{8.1}$$

$$\tilde{\Delta}\beta_t = \operatorname{Re}\left\{\rho_0 L\right\} \cos\left(2\beta_0\right). \tag{8.2}$$

Нетрудно видеть, что (8.1) можно получить из (7.1), если предположить, что

$$\Delta_2^{(1)} - \Delta_1^{(1)} = 2\rho_0. \tag{9}$$

Вместе с тем следует иметь в виду, что выражение (8.1) было получено в [8] исходя из граничных условий, предложенных в статье [9]. Последние же, как показано в [6], являются некорректными, так как могут приводить к результатам, противоречащим закону сохранения энергии.

Что касается соотношения (8.2), то оно получается из (7.2) в предположении слабого влияния приповерхностной неоднородности на отражение и преломление света:

$$\operatorname{Im}\{\Delta_s\} \ll \operatorname{Re}\{\rho_0\}L.$$
 (10)

Однако приведенные в [2] результаты измерений  $\Delta\beta_{2r}$ и  $\Delta\beta_t$  показывают, что  $\Delta\beta_{2r} \approx 2\Delta\beta_t$ . Последнее в силу (7.2) и (7.3) означает, что основной вклад в изменение поляризационных характеристик однократно и дважды прошедшего среду света вносит анизотропия приповерхностного слоя. А следовательно, предположение (10), сделанное в [2], необоснованно. Таким образом, соотношения (8) не могут использоваться для интерпретации наблюдаемых в работах [1–3] эффектов.

Посмотрим теперь на результаты [1–3], имея в виду соотношения (7). Из (7) следует, что  $\Delta\beta_{2r} = 2\Delta\beta_t$ , если только  $\operatorname{Re}\{\rho_0\} = 0$ . Следовательно, основной интерес в работе [2] (вопреки мнению авторов) представляет наблюдавшееся там небольшое *отличие*  $\Delta\beta_{2r}$  от  $2\Delta\beta_t$ , поскольку именно оно может означать, что  $\operatorname{Re}\{\rho_0\} \neq 0$ . Следует, однако, иметь в виду, что это отличие может быть вызвано и другими причинами, например эффектами второго порядка малости по  $\mu$  и (или)  $\mu_1$ . К сожалению, из текста работы [2] не ясно, может ли точность описанного там эксперимента гарантировать, что  $\Delta\beta_{2r}$  действительно не равно  $2\Delta\beta_t$ . Однако в любом случае из экспериментов [2] вытекает, что

$$\operatorname{Re}\{\rho_0\}L \ll \operatorname{Im}\{\Delta_s\}.$$
(11)

Таким образом, с учетом (11) из (7) непосредственно следует, что все наблюдавшиеся в работах [1–3] линейные эффекты обусловлены (по крайней мере в основном) неоднородностью диэлектрических свойств кристалла вблизи поверхности и прежде всего отличием симметрии приповерхностного слоя от симметрии толщи среды.

В [2] наблюдалось также некоторое отличие зависимости  $\Delta\beta_{2r}$  ( $\beta_0$ ) от предсказываемой (7.3):

$$\Delta \beta_{2r}^{(\exp)} = A \cos \left[ 2 \left( \beta_0 \right) + \Delta \beta \right) \right], \tag{12}$$

где  $\Delta\beta = 24^{\circ}$ . Учитывая, что для света, отраженного от передней грани кристалла, подобных расхождений не наблюдалось, можно предположить, что отличие (12) от (7.3) обусловлено небольшими дефектами кристаллической решетки в толще кристалла. Вместе с тем приведенных в работе [2] результатов недостаточно для полного исключения возможного влияния на возникновение  $\Delta\beta$  других причин, например дефектов задней грани кристалла, изменяющих ее симметрию.

Таким образом, экспериментальные результаты, представленные в [2], вопреки мнению авторов, указывают на выполнение (в пределах точности эксперимента) принципа симметрии кинетических коэффициентов в GaAs.

Авторы благодарны Н.И.Коротееву за полезные обсуждения, а также Российскому фонду фундаментальных исследований за частичную финансовую поддержку настоящей работы (грант 95-02-05166-а).

## Литература

- Bungay A.R., Kugler N., Zheludev N.I. // Phys. Lett. 1993. A174. P. 335.
- Bungay A.R., Popov S.V., Svirko Yu.P. et al. // Chem. Phys. Lett. 1994. 217. P. 249.
- Zheludev N.I., Popov S.V., Svirko Yu.P. et al. // Phys. Rev. 1994. B50. P. 11508.
- Lew Yan Voon L.C., Fainstein A., Etchegoin P. et al. // Phys. Rev. 1995. B52. P. 2201.
- 5. Сиротин Ю.И., Шаскольская М.П. Основы кристаллофизики. М., 1975.
- 6. Голубков А.А., Макаров В.А. // УФН. 1995. 165. С. 339.
- 7. Голубков А.А., Макаров В.А. // Изв. РАН, сер. физ. 1995. **59**, № 12. С. 93.
- Bungay A.R., Svirko Yu.P., Zheludev N.I. // Phys. Rev. 1993. B47. P. 16141.
- 9. Bungay A.R., Svirko Yu.P., Zheludev N.I. // Ibid. P. 11730.

Поступила в редакцию 30.05.97